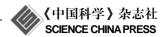
www.scichina.com csb.scichina.com



粉末与单晶 X-射线衍射对比解析灰黄霉素晶体结构

潘晴晴, 郭萍, 段炯, 承强, 李晖*

四川大学化学工程学院,成都 610065 * 联系人, E-mail: lihuilab@sina.com

粉末与单晶 X-射线衍射是解析物质晶体结构的两种重要技术,其中单晶 X-射线衍射通常被认为是解析物质晶体结构的权威方法,但是,对于很多物质而言,其符合单晶 X-射线衍射尺寸和稳定性要求的单晶体难以获得.粉末 X-射线衍射解析物质晶体结构可突破单晶培养的制约,已经开始得到学术界的认可和重视,逐步成为单晶衍射技术有效的补充和拓展.

灰黄霉素 (C₁₇H₁₇ClO₆)具有刚性结构(图 1),在二甲亚砜中极易形成块状透明的高质量单晶体,有利于衍射晶体结构解析研究.以灰黄霉素为研究对象,收集了剑桥晶体学数据库已公开的 3 组灰黄霉素单晶解析数据(代码分别为 GRISFL, GRISFLO2 和GRISFLO3),用自行培养的晶体进行了粉末和单晶 X-射线衍射实验,解析其晶体结构,对两种技术解析晶体结构的主要过程(指标化、结构解决和精修)进行了详细对比分析.

由粉末衍射实验所得的晶胞参数为 α =90.0°, a=b=8.9757 Å, c=19.9345 Å, V=1605.99 ų; 由单晶衍射实验所得的晶胞参数为 α =90.0°, a=b=8.9714 Å, c=19.8848Å, V=1600.46 ų. 剑桥晶体学数据库公开的灰黄霉素晶体结构解析结果分别为 α =90.0°, a=b=8.962 Å,

c=19.895 Å, V=1597.92 Å³(GRISFL): $\alpha = 90.0^{\circ}$, a = b = 8.967 Å, c = 19.904 Å, $V=1600.23 \text{ Å}^3(GRISFL02); \alpha=90.0^\circ,$ a=b=8.969 Å, c=19.951 Å, V=1604.92Å³(GRISFL03). 以 4 组单晶衍射数据 的统计均值为基准比较晶胞参数,各 单晶衍射所得 a, c, V 的最大相对偏差 分别为 0.06%, 0.21%和 0.25%, 粉末衍 射所得 a, c, V 的最大相对偏差分别为 0.10%, 0.13%和 0.32%. 在晶胞参数分 析的基础上,详细对比分析了粉末与 单晶 X-射线衍射技术所得灰黄霉素键 长、键角的差异. 其中, 粉末衍射所得 键长与所有已知单晶衍射所得键长的 最大相对偏差为 2.49%, 键角的最大 相对偏差为 4.19%, 均发生在灰黄霉 素五元环中的羰基相连部位, 而苯环 键长、键角的单晶-粉末测定最大相对

偏差分别为 1.66%和 3.01%,取代环己烯环键长、键角的单晶-粉末测定最大相对偏差分别为 1.87%和 2.39%.

从以上数据可以看出,两种衍射技术解析灰黄霉素晶体结构所得的晶胞参数一致,分子中键长、键角的测定基本吻合.就本实验结果而言,少数部位键长、键角测定的较大偏差应该来源于当前使用的 Rietvld 精修模块中限制性精修功能稍弱,将在后续研究中予以改进.

由粉末与单晶衍射解析灰黄霉素 晶体结构的精度及主要过程分析可知, 随着实验室粉末衍射技术的改进和计 算方法的提高,粉末衍射作为单晶衍 射强有力的辅助工具,可在有机小分 子晶体结构表征领域进行应用推广.

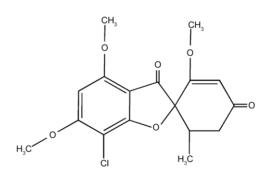


图 1 灰黄霉素分子结构